

簡易型 外観検査装置

SMTタイプのコネクタやICパッケージに対応



ACT-α 1



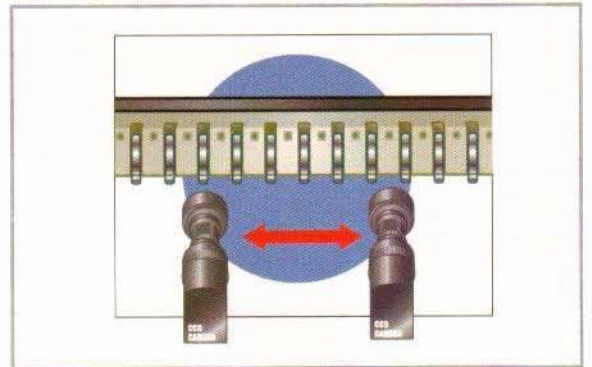
型 式	ACT-α 1 ver 11d	
メカ部構成	カメラ駆動	XY2軸
	ストローク	各100mm
	搬送	*搬送なし、手置きタイプ
検査部構成	画像処理 カメラ	35万画素モノクロ×2 *高画素カラーに変更可能
	レンズ	0.75倍テレセンレンズ×2 *Cマウントなら変更可能
	照 明	白色LEDドーム照明×2 透過照明×2
検査ステージ	ステージ寸法	100×100
	動作	モーター回転式
	種類	ワーク治具クランプタイプ
検査能力	検出分解能	約0.001mm (5mm角において)
	検査スピード	≒0.3秒 (検査+移動時間) *5ポジションで1.5秒
	主な検出項目	端子のコプラナリティー・ピッチ、 ギャップ、外形寸法
そ の 他	制御部	PLC制御、データは通信出力
	データ保存	SDカード128M
	操作設定	7インチカラータッチパネル
	基本操作	3鈕スイッチBOX
	寸法・質量	450×450×450(mm)、約36kg
	電 源	AC100V、2.5A

基本概要

検査ステージに置かれたコネクタなどの対象物のコプラナリティーやピッチを4方向から画像処理で検査を行います。カメラスライダーで任意の位置を登録することで、複数のポジションを連続的に検査することができます。
*搬送部との連結により、自動供給・エンボス排出にも対応可能

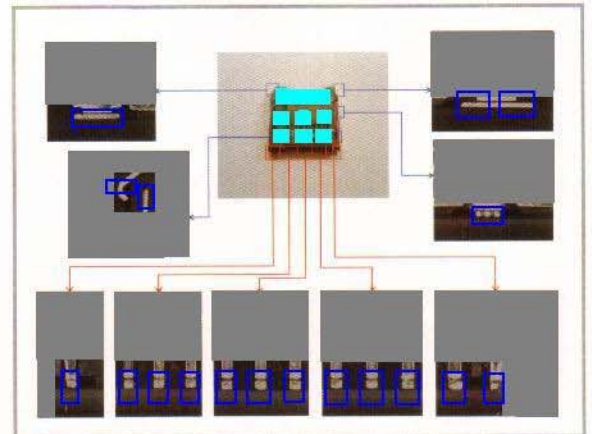
連続移動検査

標準で長さ100mmのワークまで検査対応でき、複数のワーク(長さ違い)も分割数変更により切替検査可能。
*標準で、検査時間0.3s/分割
*30mmの長さを5mm視野で6分割すると検査時間約1.8秒

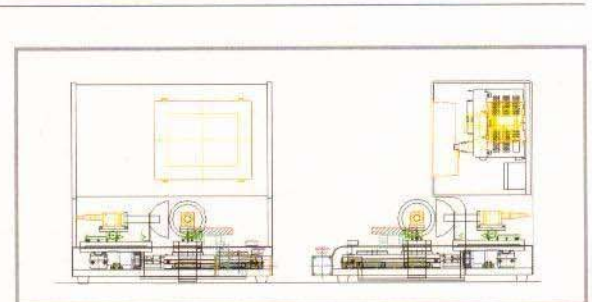


SDカードコネクタ検出例

3カメラタイプで4方向(側面×3と上面)から端子コプラナリティー・ピッチ、ギャップを検査。検査時間1.8秒



外観図



実使用状態の検査を可能にした 高精度・高速な検査システム

狭ピッチの実装コネクタ・カードコネクタ・極小チップ部品など検査の難しいワークに対応

1. 電子部品 検査ソリューション

Check Solution

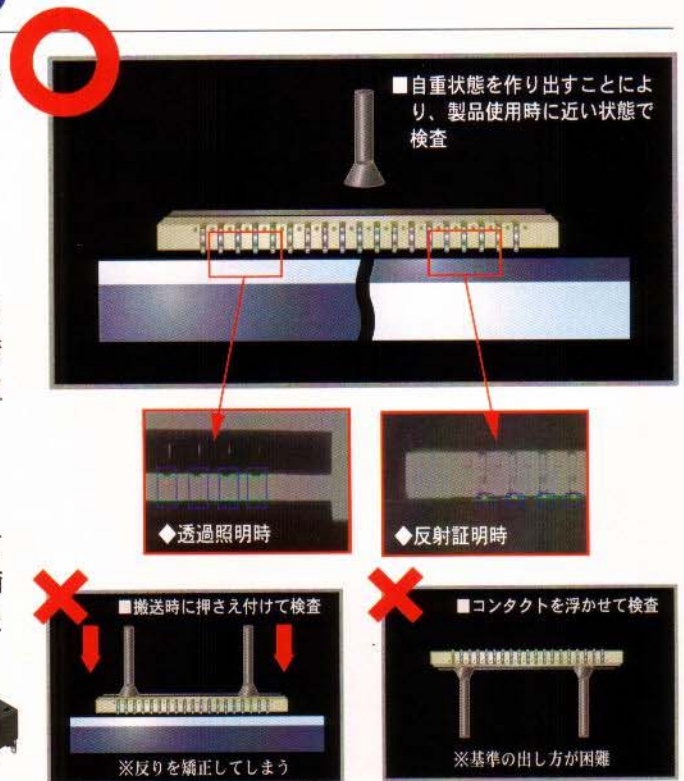
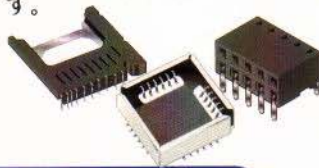
電子部品の、端子コプラナリティ・端子ピッチ・端子抜け・接点高さ、これらの外観検査を主として耐圧検査・導通検査を含んだお客様の試作評価・出荷検査の支援、装置の製作が可能

検査条件の検証・決定まで可能

画像処理の照明条件やレーザーの安定性の検証、すべて一任可能です。煩わしい部分を社内から一掃することで生産技術部門や技術部門が設計・組立工程に注力できます。

「自重状態」でコプラナリティを検査

自重状態で基準治具からの高さを検査することで本来のコプラナリティを測定できます。複数の照明技術を用いて透過状態と反射状態の両方で端子状態を検査します。

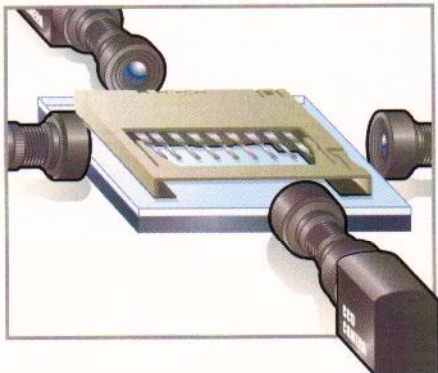


2. 検査モジュール パターン

Check Module/Pattern

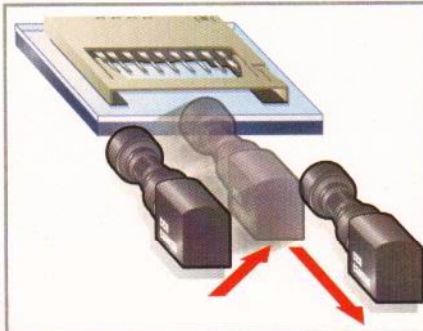
(I) 多面同時画像検査

最大6面まで同時に検査を行います。



(II) 連続移動画像検査

サーボモータでカメラを移動させながら全範囲を分割して検査を行います。



(III) 高速レーザー検査

最大300mm/secでレーザーセンサを駆動して検査を行います。

